

# 2024年度 NAIST-ARIM機器測定ワークショップ ～高速AFM測定の実際～

日時：2025年2月25日(火) – 27日(木)

会場：奈良先端科学技術大学院大学物質創成科学研究棟

定員：個別ワークショップ6組

参加登録料：無料（事前登録が必要です）

NAISTでは、皆様の研究の支援と得られたデータの集積によるデータサイエンスのための大規模データベース構築を目的とした文科省事業、ARIM（マテリアル先端リサーチインフラ）事業を実施しており、学内共通機器を学内外の研究者にご利用いただき参りました。この事業のプロモーションの一環としまして、この度、令和4年度に導入しました表面ダイナミクス解析原子間力顕微鏡装置（ブルカー社、NanoWizard ULTRA Speed 2）を用いたワークショップを開催致します。本機器にご興味をお持ちの方はもちろんのこと、これまで同等の機器を使って研究をされてこられている方々まで広く参加を募集致します。

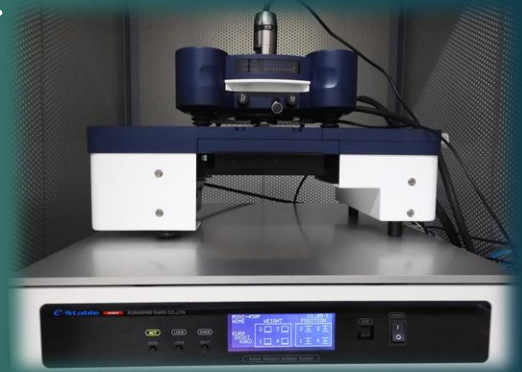
参加希望の方は、下記の登録フォームよりお申込みください。日程に関しては基本的に受理の順序に従い決めて参りますが、必要であれば調整させていただきます。何卒ご了承ください。皆様のご参加を心よりお待ちしております。

日程（ご希望の日程時間の枠を登録フォームにてお知らせ下さい）

2月25日(火) ① 10:00～13:00 ② ~~14:00～17:00~~  
2月26日(水) ③ 10:00～13:00 ④ 14:00～17:00  
2月27日(金) ⑤ 10:00～13:00 ⑥ 14:00～17:00

## 内容

- ・ AFMの使い方
- ・ 液中AFM測定方法
- ・ 参加者持ち込み試料の測定  
(試料に制限がございます 詳しくは登録フォームにてご確認ください)



## 参加申し込み

下記フォームよりお申込み下さい  
(Googleフォームを使用しています)  
2025年2月14日(金) 締切



<https://forms.gle/kyc4rntywx7B3i1X8>

## 問い合わせ先

奈良先端科学技術大学院大学  
NAIST-ARIM事務局  
TEL：0743-72-6185  
mail：arim-jimu@ms.naist.jp

ブルカージャパン株式会社  
ナノ表面計測事業部  
TEL：03-3523-6361  
mail：info-nano.bns.jp@bruker.com